

## ***Сведения о календарной загрузке оборудования***

Загрузка оборудования осуществляется по мере поступления заказов на соответствующие научно-исследовательские работы.

В 2017 году средняя загрузка оборудования составила 56.82%.

Распределение загрузки основного востребованного оборудования в часах составила:

- Масс-спектрометр времяпролетный вторично-ионный TOF.SIMS.5 (ION-TOF): 16 часов
- Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр Kratos AXIS Ultra DLD: 1071 час
- Рентгеновский порошковый дифрактометр с позиционно-чувствительным детектором и первичным монохроматором для  $\text{CuK}\alpha 1$  SIEMENS D-500: 2864 часа
- Установка рентгеновская УРС – 2: 240 часов
- Сканирующий электронный микроскоп с фокусированным ионным пучком VERSA 3D HighVac (FEI): 224 часа
- Рентгеновский монокристалльный дифрактометр с двухкоординатным CCD детектором. Oxford diffraction - Gemini R: 7572 часа
- Инфракрасный Фурье-спектрометр VERTEX 80v (Bruker) 552 часа
- Сканирующий атомно-силовой микроскоп Solver P-47 : 56 часов